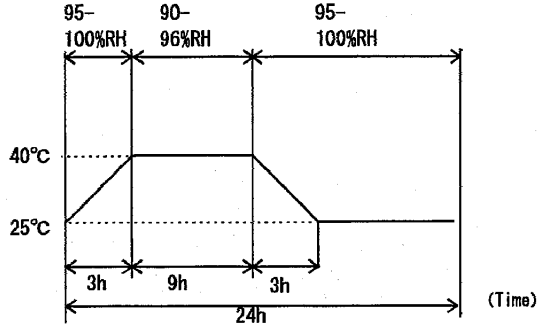
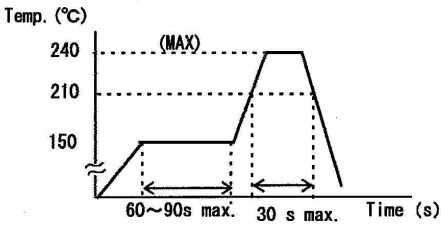


JAPAN AVIATION ELECTRONICS IND., LTD. CONNECTOR DIVISION 日本航空電子工業株式会社 コネクタ事業部 THIS SPECIFICATION TABLE CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE. この製品規格表は日本航空電子工業株式会社の 許可のない限り複写を禁じます。			SPECIFICATION TABLE 製品規格表		Connector Specification No. JACS-10275	
					Connector Series Name 品名 ST1W008S*	
					Applicable Drawing No. 製品図番 SJ104204 etc	
					TK C	
Rev. 版数	Date 発行日	DCN No	Drawn by 担当	Checked by 査閲	Approved by 承認	
1	19.May.2005	-	M.SHIMADA	-	A.NATORI	
2	9 Feb. 2009	067380	M. SHIMADA	J. MOTOJIMA	A. NATORI	
Standard data 定格						
Rated current 電 流		0.5A Max.				
Rated voltage 電 圧		10V Max.				
Operating temperature range 使用温度範囲		-25℃ ～+85℃				
Storage temperature range 保存温度範囲		-10℃ ～ +60℃				
Remark 備考 Each test for connectors should be carried out in contacting to applicable cards (MicroSized SD or TransFlash) . 各試験は、適合カード (MicroSized SD or TransFlash) との接触状態にて行う。						
Item		Procedure 試験方法		Requirement 規定		
MECHANICAL 機械的性能						
Examination of product 構造寸法表示				Meets requirements of product drawing. 図面と相違なきこと。		
Durability 寿命試験		10,000 cycles with card at the speed rate of 400-600 cycles/hour. (1 Cycle = Cover Opening and Closing with card inserted) カード挿抜を 10,000 サイクル繰り返す。 速度 : 400～600 サイクル/時間 (1 サイクル＝カード挿入状態のカバーを開け閉めする)		No mechanical damage. It should meet the contact resistance. 機械的損傷なきこと。 試験後、接触抵抗を満足すること。		
Free Fall 落下試験		JISC0044 Height : 1.5m Floor : P-tile Direction/Count : 6planes dropping, 2times each (total: 12times) Specimens should be included in the chassis. JISC0044 に準拠。 落下高さ : 1.5m 落下床面 : P-タイル 落下方向及び回数 : 6 面落下、各 2 回 (計 12 回) 筐体組込み状態にて試験を実施		No mechanical damage. 機械的損傷なきこと。		

Item	Procedure 試験方法	Requirement 規定
Vibration 振動	IEC 60068-2-6 Fc Amplitude: 10mm, Acceralation : 20m/s ² Wavelength : 10-2000-10Hz/5min. cycle : 10/axis (50min), 3axes (total: 150min) Test current : 1mA IEC 60068-2-6 Fc に準拠 振幅 : 10mm 加速度 : 20m/s ² 周波数 : 10~2000~10Hz/5min. サイクル : 各軸 10 サイクル(50min)、3 軸 (計 150min) 試験電流 : 1mA	No electrical discontinuity more than 0.1 μs. It should meet contact resistance after the test. 試験中、電気の瞬断は 0.1 μs 以下であること。 試験後、接触抵抗を満足すること。
Shock 衝撃	IEC 60068-2-27 Ea, Half sine curve 490m/s ² , 11ms 1 axis, plus-minus direction, core 3 times (total: 18times) Test current: 10mA IEC 60068-2-27 Ea に準拠 半波正弦波 加速度 : 490m/s ² , 作用時間 : 11ms 1 軸、正負方向、各 3 回 (計 18 回) 試験電流 : 1mA	No electrical discontinuity more than 0.1 μs. It should meet contact resistance after the test. 試験中、電気の瞬断は 0.1 μs 以下であること。 試験後、接触抵抗を満足すること。
ELECTRICAL 電気的性能		
Contact Resistance 接触抵抗	IEC 60512-2-2 Test current: 1mA Open voltage: 20mV IEC 60512-2-2 に準拠 試験電流: 1mA 開放電圧: 20mV	Initially : 100mΩ Max. After test : 40mΩ Max. change 初期 : 100mΩ 以下 試験後 : 変化量 40mΩ 以下
Insulation Resistance 絶縁抵抗	IEC 60512-2-3 Apply 500V DC between adjacent contacts and measure the insulation resistance. IEC 60512-2-3 に準拠 近接コンタクト間に DC500V を印加し、絶縁抵抗を測定する。	Initial: : 1000MΩ (Min.) After test: : 100MΩ (Min.) 初期 : 1000MΩ 以上 試験後 : 100MΩ 以上
Dielectric Withstanding Voltage 耐電圧	IEC 60512-2-4 Apply the specified voltage between adjacent contacts. IEC 60512-2-4 に準拠 近接コンタクト間に規定電圧を印加する。	AC 500V rms. No breakdown caused for 1minute. AC500V rms. 1 分間異常の無いこと。
Temperature Rise 温度上昇	IEC-512-3-5a Test current : 0.5A / contact IEC-512-3-5a に準拠 試験電流 : 0.5A / 1 端子	30°C rise MAX 上昇温度 30°C 以下

Item	Procedure 試験方法	Requirement 規定
ENVIRONMENTAL 環境的性能		
Damp Heat 温湿度サイクル	IEC 60068-2-30 Db, 10 cycles IEC 60068-2-30 Db に準拠。10 サイクル 	It should meet the insulation resistance and the contact resistance after the test. 試験後、絶縁抵抗、接触抵抗を満足すること。
Thermal Shock (Change of temperature) 熱衝撃	IEC 60068-2-14 Na -55~+85 °C, 5 cycles, 1cycle for 1h IEC 60068-2-14 Na に準拠 -55°C~+85°C 5 サイクル 1 サイクル 1h	No mechanical damage. It should meet the insulation resistance and the contact resistance after the test. 機械的損傷無きこと。 試験後、絶縁抵抗、接触抵抗を満足すること。
Dry Heat (Steady state) 高温放置	IEC 60068-2-2 Bb +85°C, 96 h. IEC 60068-2-2 Bb に準拠。 +85°C、96 時間	It should meet the contact resistance after the test. 試験後、接触抵抗を満足すること。
Dry Cold (Steady state) 低温放置	IEC 60068-2-1 Ab -25°C, 96 h IEC 60068-2-1 Ab に準拠 -25°C、96h	It should meet the contact resistance after the test. 試験後、接触抵抗を満足すること。
Damp heat (Steady state) 耐湿性	IEC 60068-2-66 Cx 40°C, 90~95%, 96h. IEC 60068-2-66 Cx に準拠 40°C, 90~95%, 96h	It should meet the insulation resistance and the contact resistance after the test. 試験後、絶縁抵抗、接触抵抗を満足すること。
Hydrogen Sulfide H ₂ S ガス	IEC 60068-2-43 Kd Concentration : 3±1ppm Test temperature : 40±2°C Test period : 96±4h IEC 60068-2-43 Kd に準拠 ガス濃度 : 3±1ppm 温度 : 40±2°C 時間 : 96±4h	It should meet the contact resistance after the test. 試験後、接触抵抗を満足すること。

Item	Procedure 試験方法	Requirement 規定
Soldering Heat Resistance 半田耐熱性	Compliant with EIAJ RCR-5201  EIAJ RCR-5201 に準拠	No damage like crack and meets requirements of product drawing in 3 tests. 3 回の試験において、クラック、膨れ等の発生無く、図面寸法を満足すること。
Manual Soldering Heat 手半田耐熱性	Soldered part: solder tale Temperature : $350\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ Duration : $5 \pm 0.5\text{ s}$ 半田部位 : ソルダータール部 温度 : $350\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 10\text{ }^{\circ}\text{C}$ 印加時間 : $5 \pm 0.5\text{ 秒}$	No damage. 外観に異常ないこと。
Solderability 半田付け性	Dip in for 5s in soldering bath of $230\text{ }^{\circ}\text{C}$. $230\text{ }^{\circ}\text{C}$ の半田槽に 5 秒間浸漬する。	Solder should be covered on more than 75% area dipped. 浸した部分の 75%以上が半田に覆われていること。

Notes 注記

1. Handle Care 取扱い注意事項

Refer to the manual JABL-10275
取扱い説明書 JABL-10275 を参照願います。

2. Packing 梱包仕様

- Packing Component 梱包部材
- Carrier tape キャリアテープ
 - External package 外装箱
Large $400*400*300$
Small $400*400*150$
 - Bubble wrap エアキャップ
 - Packing tape ガムテープ
 - Article slip 現品票

Connector packed Q'ty コネクタ収納数
1,500 pcs. / Reel
*Refer to SJ104310 etc.

Reel packed Q'ty リール収納数

- Large : 10R
- Small : 5R

